

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 23 AOUT 2004

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

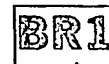
BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 210502

REMISE DES PIÈCES DATE 22 AOUT 2003 LIEU 75 INPI PARIS B N° D'ENREGISTREMENT 0310116 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 22 AOUT 2003 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET PLASSERAUD 84, rue d'Amsterdam 75440 PARIS CEDEX 09	
Vos références pour ce dossier (facultatif) BFF030311			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE Demande de brevet Demande de certificat d'utilité Demande divisionnaire <i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		Cochez l'une des 4 cases suivantes <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> N° _____ Date _____ N° _____ Date _____ N° _____ Date _____ N° _____ Date _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF ET PROCEDE DE DETECTION ET DE MESURE NON INVASIVES DES PROPRIETES D'UN MILIEU			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou siège Rue Code postal et ville Pays Nationalité N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif)		CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS - Etablissement Public, Scientifique et Technologique EPST 3, rue Michel Ange 75016 PARIS Cédex 16 FRANCE Française N° de télécopie (facultatif) <input checked="" type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	

Remplir impérativement la 2^{ème} page

REMISE DES PIÈCES	
DATE	22 AOUT 2003
LIEU	75 INPI PARIS B
N° D'ENREGISTREMENT	0310116
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	

DB 540 W / 210502

6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		BFFQ30311
Nom		
Prénom		
Cabinet ou Société		
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		Cabinet PLASSERAUD
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	84 rue d'Amsterdam
	Pays	
N° de téléphone (facultatif)		75009 PARIS
N° de télécopie (facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)		
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) ERIC BURBAUD 94-0304		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI M. MARTIN

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Page suite N° ... / ...

BR/SUITE

REMISE DES PIÈCES
DATE
LIEU
N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

Réservé à l'INPI

22 AOUT 2003
INPI PARIS B
03 10116

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 829 W / 010702

Vos références pour ce dossier (facultatif)		BFF030311
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique
Nom ou dénomination sociale		ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN
Prénoms		
Forme juridique		Etablissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel
N° SIREN		
Code APE-NAF		
Domicile ou siège	Rue	61, av. du Président Wilson 94235 CACHAN Cédex
	Code postal et ville	
	Pays	FRANCE
Nationalité		Française
N° de téléphone (facultatif)		
N° de télécopie (facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)		
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique
Nom ou dénomination sociale		
Prénoms		
Forme juridique		
N° SIREN		
Code APE-NAF		
Domicile ou siège	Rue	
	Code postal et ville	
	Pays	
Nationalité		
N° de téléphone (facultatif)		
N° de télécopie (facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)		
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI M. MARTIN

Eric BURBAUD
94-0304

Dispositif et procédé de détection et de mesure non invasives des propriétés d'un milieu

La présente invention est relative aux dispositifs
5 et procédés de détection et de mesure non invasives des
propriétés optiques et de champs électriques d'un milieu.

Plus particulièrement, l'invention concerne un
dispositif de détection non invasive des propriétés d'un
milieu par interférométrie, ce dispositif comprenant :

10 - une source optique pour éclairer au moins une
zone à sonder du milieu avec un faisceau lumineux dont le
parcours définit un axe optique,

- des moyens de mesure des variations de la phase
du faisceau lumineux au cours de son passage dans la zone à
15 sonder, ces moyens de mesure

. comprenant un interféromètre pour diviser le
faisceau lumineux en un faisceau de référence et un faisceau
sonde, dans cet interféromètre, l'asservissement des
longueurs respectives du faisceau de référence et du
20 faisceau sonde étant actif jusqu'à une fréquence de coupure
fc, et

. ayant une fréquence d'échantillonnage de
signal fa.

Le document US-A-5 394 098 décrit un exemple d'un
25 tel dispositif utilisé pour tester des composants opto-
électroniques, en utilisant une source optique constituée
d'un laser. Plus précisément, des champs électriques sont
mesurés dans les composants opto-électroniques par
l'intermédiaire d'une couche de matériau constituant un
30 milieu optiquement actif recouvrant au moins la partie du
composant que l'on veut tester.

Dans le présent document, on désigne par "milieu
optiquement actif", un milieu présentant des propriétés

électro-optiques et plus particulièrement un milieu présentant un effet électro-optique linéaire (dit effet Pockels), ou un effet électro-optique quadratique dont le seuil de manifestation est toutefois plus élevé que dans le cas linéaire, tout en restant compatible avec l'usage de lasers de puissance à impulsions brèves.

Ce type de dispositif présente cependant l'inconvénient de ne permettre des mesures qu'avec une fréquence d'échantillonnage de signal f_s supérieure à la fréquence de coupure f_c . Ce type de dispositif ne peut pas être utilisé en particulier pour la détection de champs électriques en volume dans des milieux biologiques. Car les variations de d'indice de réfraction dues aux champs électriques dans les systèmes biologiques ont essentiellement lieu à des fréquences inférieures à 1 kHz alors que la fréquence f_c doit être de quelques kHz pour éliminer les bruits extérieurs (thermiques, mécaniques, acoustiques, etc.).

La présente invention a notamment pour but de pallier cet inconvénient.

A cet effet, on prévoit selon l'invention, un dispositif de détection non invasive des propriétés d'un milieu par interférométrie, qui, outre les caractéristiques déjà mentionnées, est caractérisé par le fait qu'il comporte des moyens de balayage adaptés pour balayer, avec le faisceau sonde, la zone à sonder et une zone de référence, avec une fréquence f d'acquisition d'images enregistrées par les moyens de mesure des variations de la phase du faisceau lumineux, supérieure à la fréquence de coupure f_c .

Ainsi, on obtient une modulation de la fréquence de variation du signal correspondant au phénomène électro-optique observé, à une fréquence f plus élevée et avantageusement plus élevée que la fréquence de coupure f_c

de l'asservissement (qui est passe bas) des longueurs respectives du faisceau de référence et du faisceau sonde.

Notons également que la zone de référence peut avoir une taille minimale d'un pixel.

5 Dans des modes de réalisation de l'invention, on peut éventuellement avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :

10 - les moyens de balayage balayent la zone à sonder et la zone de référence selon une première direction de l'espace, à une fréquence f_x et selon une deuxième direction de l'espace avec une fréquence f_y , pour former une image de n pixels selon la première direction et m pixels selon la deuxième direction, les fréquences f_x et f_y étant choisies telles que $f_x = f_y/n$ et $f_y = f_a/m$, f_x et f_y étant supérieures à
15 f_c ; en fait, ces première et deuxième directions de l'espace sont perpendiculaires à l'axe optique ;

20 - les moyens de mesure des variations de la phase du faisceau lumineux comprennent un microscope confocal, dans lequel est placée la zone à sonder de manière adaptée pour former une image d'un plan de la zone à sonder; ainsi, grâce au microscope confocal, on peut obtenir une résolution spatiale tridimensionnelle ; il est alors possible de sonder le volume du milieu ; cette disposition permet de sonder des milieux, sans préparation particulière si le milieu est doté
25 de propriétés électro-optiques; la résolution spatiale de la mesure des champs électriques n'est limitée que par l'optique utilisée ;

30 - il comporte des moyens de déplacement du milieu, selon les trois dimensions de l'espace, sous le faisceau sonde;

- les moyens de balayage comprennent quatre déflecteurs acousto-optiques, deux pour défléchir le faisceau lumineux, en amont du microscope confocal, chacun

respectivement dans l'une des première et deuxième directions de l'espace et deux pour redresser le faisceau lumineux chacun respectivement dans l'une des première et deuxième directions de l'espace, en aval du microscope
5 confocal ;

- au moins un déflecteur acousto-optique, en aval du microscope confocal, est réglé pour incliner l'ordre 0 du faisceau lumineux par rapport à l'axe optique, et conserver l'ordre 1 paraxial ; ainsi, l'ordre 0 du faisceau quitte
10 l'axe optique et l'un des ordres 1 du faisceau, en sortie des premiers déflecteurs, a une position moyenne dans l'axe optique ; si l'intensité de l'ordre 0 du faisceau est non nulle, la partie correspondante du faisceau quitte l'axe optique et ne parvient ni sur la zone à sonder, ni sur les
15 moyens de photo-détection du faisceau ; éventuellement une lunette de Galilée permet d'augmenter l'angle entre l'ordre 1 et l'axe optique ; et

- il comporte, en amont du microscope confocal, des moyens de contrôle de la polarisation du faisceau sonde en
20 incidence sur la zone à sonder.

. De nombreux autres types de balayage que celui mentionné ci-dessus peuvent être envisagés. Pour n'en citer que quelques-uns :

. Balayage rectangulaire : Le balayage est effectué sur
25 une zone d'intérêt, comprenant la zone à sonder et la zone de référence, plus petite que la surface effectivement accessible. Ce type de balayage est en particulier intéressant si la zone à sonder est réduite, on peut alors en profiter pour balayer à plus haute fréquence avec la même
30 résolution ou augmenter la résolution en resserrant les pixels ou toute solution intermédiaire.

. Balayage de plusieurs rectangles : Le balayage est effectué sur une zone correspondant à un ensemble de

rectangles tels que ceux décrits au paragraphe précédent. La zone de référence peut être unique alors que les différentes zones à sonder correspondent à des rectangles différents. Ceci peut être utile si la zone à sonder ne peut être
5 couverte par un seul rectangle.

. Balayage sur des surfaces de formes variées : Le balayage est effectué des surfaces circulaires, elliptiques, triangulaires, etc., ou sur une composition de ces surfaces.

. Balayage sur des surfaces complexes : Le balayage est
10 effectué sur des surfaces aux formes complexes, telles que l'application le nécessite, par exemple pour l'étude de tout ou partie d'un composant opto-électronique ou d'un système biologique (neurone, membrane, ...).

. Balayage paramétré : Le balayage est effectué selon
15 des trajectoires avec des coordonnées x et y paramétrées comme suit :

$$x = \cos (w.n.t)$$

$$y = \cos (w.n.m.t)$$

où n et m sont sensiblement les nombres de pixels
20 correspondant à une période d'acquisition respectivement selon les coordonnées x et y . Ce type de balayage permet de s'approcher au maximum des limites des modulateurs acousto-optiques. Bien entendu, on peut aussi ne conserver ce paramétrage que sur l'une des deux coordonnées.

25 Notons que la réalisation du système de commande de ces différents types de balayage sont connus de l'Homme du Métier.

Selon un autre aspect, l'invention concerne un procédé de mise en œuvre du dispositif selon l'invention. Il
30 s'agit, en particulier, d'un procédé de détection non invasive des propriétés d'un milieu par interférométrie, dans lequel :

- on éclaire au moins une zone à sonder du milieu

avec une source optique générant un faisceau lumineux dont le parcours définit un axe optique,

- on utilise un interféromètre pour diviser le faisceau lumineux en un faisceau de référence et un faisceau sonde et mesurer le déphasage entre le faisceau de référence et le faisceau sonde après traversée de la zone à sonder,

- on asservit des longueurs respectives du faisceau de référence et du faisceau sonde à des moyens de photo-détection et

- on acquiert, avec les moyens de photo-détection, des images correspondant à la mesure du déphasage en différents points de la zone à sonder, avec une fréquence d'échantillonnage de signal f_s supérieure à la fréquence de coupure f_c de l'asservissement des longueurs respectives du faisceau de référence et du faisceau sonde, caractérisé par le fait qu'on balaye avec le faisceau sonde, la zone à sonder et une zone de référence, avec une fréquence f d'acquisition d'images enregistrées par les moyens de mesure des variations de la phase du faisceau lumineux, supérieure à la fréquence de coupure f_c .

Dans des modes de mise en œuvre du procédé selon l'invention, on peut éventuellement avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :

- on procède à un balayage de la zone à sonder et la zone de référence selon une première direction de l'espace à une fréquence f_x et selon une deuxième direction de l'espace avec une fréquence f_y , pour former une image de n pixels selon la première direction et m pixels selon la deuxième direction, les fréquences f_x et f_y étant choisies telles que $f_x = f_y/n$ et $f_y = f_a/m$, f_x et f_y étant supérieures à f_c .

- on excite le milieu à une fréquence f_e et on mesure la variation de la phase du faisceau sonde par

rapport à celle du faisceau de référence, à cette même fréquence f_e ;

- connaissant la distribution des propriétés électro-optiques du milieu, on réalise une cartographie du champ électrique dans le milieu ;

- on génère un champ électrique de configuration connue dans le milieu, de manière à révéler des propriétés électro-optiques du milieu ; et

- on dope le milieu avec des molécules, des ions, etc. ayant des propriétés électro-optiques, ou conférant au milieu des propriétés électro-optiques, afin d'exacerber les propriétés électro-optiques du milieu, si celui-ci en est déjà doté, ou pour révéler la présence de champs électriques dans un milieu qui ne possède pas intrinsèquement de telles propriétés.

La nature des milieux sondés peut, grâce à l'invention, être très diverse. Outre les composants opto-électroniques déjà cités, il peut s'agir d'une distribution locale, par exemple une interface entre deux milieux diélectriques distincts éventuellement dépourvus chacun de toute activité électro-optique intrinsèque. L'interface entre les deux milieux à caractères individuellement non électro-optiques, induit alors une brisure structurelle de centrosymétrie au voisinage de la discontinuité et la possibilité d'un effet électro-optique. Selon un autre exemple de distribution locale des propriétés électro-optiques, le milieu est amorphe. Il s'agit par exemple d'une matrice polymère contenant une solution solide de molécules électro-optiques dispersées aléatoirement et qui ont été localement orientées selon un ordre statistique non-centrosymétrique (sous l'effet d'un champ électrique induit localement par une électrode adéquate ou par des champs optiques selon une configuration dite d'orientation tout

optique qui agit localement à la focale des faisceaux orientateurs). On peut désigner de telles occurrences locales de propriétés électro-optiques sous les appellations suggestives de "surfaces électro-optiques" (cas de la distribution bidimensionnelle ou quasi-bidimensionnelle de type membrane) ou d'"îlots électro-optiques" (voxels) dans le cas d'inclusions de structures électro-optiques exogènes au milieu ambiant. Par exemple, il s'agit dans ce cas, d'inclusions de structures électro-optiques dans un film de type polymère amorphe dépourvu de propriétés électro-optiques intrinsèques (ces inclusions présentant des dimensions aux échelles nanométriques ou microniques ; ce sont par exemple des nanocristaux présentant des propriétés non linéaires quadratiques). On peut, à l'inverse, créer par désorientation axiale un défaut local d'effet électro-optique au sein d'une structure électro-optique initialement homogène (telle qu'obtenue par orientation quasi-uniforme sous champ électrique dans une configuration classique de type aiguille corona). L'invention a en particulier de l'intérêt dans deux situations symétriques. D'une part, elle permet, quand la distribution des propriétés électro-optiques est inconnue, de révéler la cartographie spatiale de cette distribution a priori inconnue par mise sous champ électrique avec un jeu d'électrodes simples permettant de maîtriser aussi bien que possible la distribution du champ au sein de l'échantillon. D'autre part, quand la distribution spatiale des propriétés électro-optiques est bien connue par d'autres moyens (par exemple dans le cas d'un procédé technologique d'élaboration contrôlée de cette distribution), l'invention permet de déterminer la cartographie du champ interne ou externe au sein de la distribution, celle-ci dépendant à la fois de cette distribution a priori connue des propriétés électro-

optiques, mais également de la géométrie des électrodes au travers desquelles est appliqué un champ électrique externe. Dans certains cas intermédiaires, la connaissance, tant de la distribution du champ électrique que des propriétés électro-optiques des structures, s'avère limitée. L'invention permet alors de réaliser avec certitude, en amont de cette double inconnue, une cartographie du déphasage optique ressenti par l'onde incidente qui vient sonder le milieu. Pour progresser dans la levée des indéterminations, l'homme de l'art émet alors des hypothèses structurelles et/ou physiques soit sur la structure du milieu électro-optique, soit sur la distribution du champ, soit sur une conjonction des deux.

D'autres aspects, buts et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description d'un de ses modes de réalisation.

L'invention sera également mieux comprise à l'aide des dessins, sur lesquels :

- la figure 1 est un schéma de principe d'un exemple de mode de réalisation d'un dispositif conforme à la présente invention ;

- la figure 2 représente schématiquement les moyens de balayage du dispositif de la figure 1 ;

- la figure 3 représente schématiquement le balayage réalisé avec les moyens de balayage de la figure 2 ;

- la figure 4 représente schématiquement une variante d'une partie du dispositif des figures 1 à 3 ; et

- les figures 5a à 5f représentent schématiquement quelques exemples d'applications du procédé selon l'invention.

Sur les différentes figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou similaires.

Un exemple de mode de réalisation du dispositif selon l'invention est présenté ci-dessous en relation avec les figures 1 à 5.

5 Selon cet exemple, le dispositif selon l'invention est un dispositif de détection et cartographie quantitatives et non invasives d'un champ ou potentiel électrique ou encore de leurs dérivées spatiales et/ou temporelles dans un milieu optiquement actif, éventuellement structurellement connu.

10 Comme représenté sur la figure 1, ce dispositif 1 est un microscope. Il comporte une source optique 3 et un interféromètre 5 constitutif de moyens de cartographie du déphasage d'un faisceau lumineux 7. Il permet ainsi de mesurer les variations de l'indice de réfraction.

15 La source optique 3 est par exemple un laser. La longueur d'onde, la puissance et la nature (pulsée ou continue) de ce laser sont, bien entendu, à adapter au milieu à sonder et plus particulièrement aux espèces (molécules, ions, matériau électronique, etc.) optiquement
20 actives révélant le champ électrique régnant dans ce milieu. Par exemple, pour une application à l'étude de composants opto-électroniques on peut être amené à utiliser un laser He-Ne émettant à 632,8 nm, avec une puissance de quelques milliwatts.

25 L'interféromètre 5 comporte des moyens séparateurs 9, par exemple constitués d'une lame demi-onde et d'un polariseur, des miroirs asservis 11, un porte-échantillon 13, un microscope confocal 15 et des éléments optiques 17. Selon l'exemple de mode de réalisation du microscope
30 présenté sur la figure 1, la détection de champs électriques est effectuée en transmission. Bien entendu, il est à la portée de l'Homme du Métier de transposer cet enseignement pour effectuer cette détection en réflexion.

L'interféromètre 5 est monté en détection homodyne. Les moyens séparateurs 9 divisent le faisceau lumineux 19 émis par la source 3 en un faisceau de référence 21 et un faisceau sonde 23. La quadrature entre le faisceau de référence 21 et le faisceau sonde 23 est asservie à $\pi/2$ afin d'avoir accès à la variation relative de chemin optique. Un exemple d'asservissement des miroirs 11 est donné dans le mémoire de thèse doctorale de P. F. Cohadon (Laboratoire Kastler-Brossel, université Paris VI, Janvier 2000).

Le faisceau sonde 23 est focalisé, en une région d'un échantillon 25 monté dans le porte-échantillon 13, par l'intermédiaire d'une première optique 27 du microscope confocal 15. Une deuxième optique 28 du microscope confocal 15 collecte le faisceau lumineux transmis par l'échantillon 25 au niveau de cette région. Notons que dans le cas d'une détection en réflexion, la réflexion peut éventuellement avoir lieu après la deuxième optique 28. Le faisceau lumineux est alors filtré par les éléments optiques 17 comprenant un diaphragme qui intercepte tout signal ne passant pas par le foyer de la deuxième optique 28.

L'échantillon 25 est déplacé sous le faisceau sonde 23 grâce à une cale piézoélectrique qui déplace le porte-échantillon 13, dans les trois directions de l'espace. L'échantillon 25 est ainsi sondé en volume. Grâce à la cale piézoélectrique, il est possible d'effectuer une cartographie tridimensionnelle des champs électriques dans l'échantillon 25.

Le faisceau sonde 23 est détecté et enregistré par les moyens de cartographie du déphasage du faisceau lumineux 7. Plus précisément, ces moyens comportent des détecteurs 29 et une électronique de traitement et d'asservissement 31.

Les détecteurs 29 sont des photodiodes ultra-rapides à haute sensibilité telles que celles décrites dans le

mémoire précité de la thèse doctorale de P. F. Cohadon. Ces détecteurs 29 servent aussi bien pour l'asservissement de la longueur relative des chemins optiques du faisceau de référence 21 et du faisceau sonde 23, que pour
 5 l'enregistrement du signal transmis par l'échantillon 25.

L'électronique de traitement et d'asservissement 31 est une électronique haute fréquence connue de l'Homme du Métier.

Le dispositif 1 comporte en outre des moyens de
 10 balayage 33 du faisceau sonde 23 sur l'échantillon 25.

Ces moyens de balayage 33 sont illustrés de manière plus détaillée par la figure 2. De nombreux modes de réalisation des moyens de balayage 33 peuvent bien entendu être envisagés par l'Homme du Métier. Seul, ici, un mode de
 15 réalisation est présenté. Selon ce mode de réalisation, les moyens de balayage 33 comportent quatre déflecteurs acousto-optiques 35.

Deux de ces déflecteurs 35 sont placés en amont du microscope confocal 15 pour défléchir le faisceau sonde 23.
 20 Ces déflecteurs 35 en amont du microscope confocal sont inclinés de manière à ne conserver que l'ordre 1 du faisceau parallèle à l'axe optique. L'un de ces deux déflecteurs génère un balayage de l'échantillon 25, avec le faisceau sonde 23, selon une première direction de l'espace, à une
 25 fréquence f_x , qui est aussi la fréquence d'acquisition. L'autre de ces deux déflecteurs génère un balayage de l'échantillon 25, avec le faisceau sonde 23, selon une deuxième direction de l'espace, à une fréquence f_y (voir figure 3). On forme ainsi une image de n pixels selon la
 30 première direction et m pixels selon la deuxième direction. Si la fréquence d'échantillonnage de signal est f_a , les fréquences f_x et f_y sont choisies telles, que $f_x = f_y/n$ et $f_y = f_a/m$ et qu'elles soient toutes deux supérieures à la

fréquence de coupure f_c .

Les deux autres des quatre déflecteurs 35 sont placés en aval du microscope confocal 15 et permettent de redresser le faisceau sonde 23, chacun respectivement dans l'une des première et deuxième directions de l'espace.

Les moyens de balayage 33 permettent de moduler, à la fréquence f_x supérieure à la fréquence de coupure f_c , le signal provenant des éventuels champs électriques détectés.

Comme illustré par la figure 3, on enregistre le signal transmis par l'échantillon 25 au cours du balayage selon les première et deuxième directions. Ce balayage passe par une zone à sonder 34 et une zone de référence 36. Cette zone de référence 36 peut être une zone de l'échantillon 25 lui-même dans laquelle ne varient pas les champs électriques. On soustrait alors de l'image du signal provenant des éventuels champs électriques détectés, une image de référence, c'est-à-dire une image de la phase sans potentiel ou avec un potentiel de référence ou de repos. On ramène ainsi, sur un fond noir, l'image du signal provenant des éventuelles variations détectées des champs électriques. On a donc réalisé une détection synchrone.

La démodulation du signal provenant des éventuels champs électriques détectés, est réalisée au niveau de l'électronique de traitement et d'asservissement 31, d'une manière classique.

Selon encore une variante du dispositif conforme à l'invention, représentée sur la figure 4 et qui peut être combinée avec le mode de réalisation déjà exposé, celui-ci comporte des moyens de contrôle de la polarisation 37 du faisceau sonde 23. Ces moyens de contrôle de la polarisation 37 permettent de faire varier de manière contrôlée l'état de polarisation du faisceau sonde 23 incident sur l'échantillon 25. Il s'agit par exemple de moyens de contrôle de la

polarisation 37 adaptés pour obtenir une polarisation linéaire du faisceau sonde 23 dont l'angle ρ de polarisation dans le plan transverse à l'axe de propagation, est variable sur 360° . De tels moyens de contrôle de la polarisation 37
5 peuvent être constitués par n'importe quel dispositif connu de l'Homme du Métier, de préparation et de rotation d'un état de polarisation linéaire dans le plan transverse à l'axe optique. En particulier, ils peuvent comprendre une lame demi-onde et/ou un polariseur..

10 De tels moyens de contrôle de la polarisation 37 sont disposés en amont de la première optique 27. L'Homme du Métier est alors apte à mener les calculs correctifs nécessaires au passage de l'état de polarisation linéaire en amont de cette première optique 27, à l'état de polarisation
15 elliptisé au niveau de l'échantillon 25. Un analyseur de polarisation 39 facultatif peut être placé à la sortie de la deuxième optique 28, en complément des moyens de contrôle de la polarisation 37.

Le dispositif selon l'invention peut être utilisé
20 pour détecter des champs électriques dont les variations interviennent à une fréquence inférieure à la fréquence de coupure f_c de l'asservissement de la longueur relative du faisceau de référence 21 et du faisceau sonde 23. Ainsi, il peut être utilisé pour la détection de signaux périodiques
25 ou non, transitoires ou non et reproductibles ou non.

Le dispositif décrit ci-dessus peut être mis en œuvre dans de nombreuses applications.

A titre d'exemple, ce dispositif peut être mis en œuvre dans un procédé, conforme à l'invention, de test de
30 composants opto-électroniques.

Dans ce document, on désigne par composant opto-électronique, un composant électronique, microélectronique, optronique, ou bien encore un circuit comprenant des

composants d'au moins l'un de ces types. Avantageusement, ces composants opto-électroniques présentent un effet électro-optique, au moins dans une partie de la zone à étudier et/ou à cartographier.

5 Plus particulièrement, dans ce type de procédé, on crée un potentiel d'excitation périodique et reproductible entre deux électrodes. La zone à sonder 34 comporte au moins une partie d'un composant opto-électronique auquel on applique ce potentiel.

10 Ce type de procédé peut être utilisé pour l'étude de milieux segmentés (voir figure 5a). Il permet alors de caractériser et de valider des procédés de fabrication de composants opto-électroniques à des échelles microniques et/ou submicroniques. Par exemple, on peut ainsi mesurer la
15 résolution de zones gravées optiquement actives.

Ce type de procédé peut également être mis en oeuvre pour l'étude de gradient de champs électriques, notamment par mise en oeuvre d'électrodes de forme non triviale (figure 5b). Il s'agit par exemple d'électrodes
20 multipolaires (cf. géométrie octupolaire telle que décrite dans l'article J. Zyss, Nonlinear Optics, vol. 1, p. 3, 1991 ; voir également figure 5c), auxquelles on applique un potentiel électrique. Une structure électro-optique de symétrie multipolaire adaptée à celle des électrodes permet
25 de révéler la dérivée du champ ; par exemple la dérivée seconde du champ au centre d'un jeu d'électrode octupolaire tel que décrit à la figure 5c, le champ et sa première dérivée s'annulant par symétrie au centre de la micro-cellule d'orientation qui y est schématisée. Il est ainsi
30 possible, grâce au procédé selon l'invention, de réaliser, la cartographie de gradients ou de courbures de champs électriques dans des zones optiquement actives. Ces cartes de champs peuvent être confrontées à des calculs pour les

valider et affiner des modèles ou permettre au contraire de rechercher des configurations de champ dont les propriétés particulières sont difficilement accessibles par le calcul.

5 Ce type de procédé peut encore être mis en oeuvre pour l'étude de champs multipolaires (voir figure 5c). Dans ce cas, le potentiel est appliqué par l'intermédiaire d'au moins une électrode à symétrie multipolaire. Des configurations d'électrodes à symétrie multipolaire donnent accès à des structures de champs multipolaires. De telles
10 structures de champs multipolaires permettent d'accéder, par exemple, à la compréhension de la répartition en orientation de molécules sous l'influence de ces champs multipolaires.

Selon une autre application du procédé selon l'invention, on étudie la propagation d'impulsions dans un
15 conducteur (fil, circuit intégré, composant opto-électronique, etc.). Ce conducteur est alors placé dans un milieu optiquement actif. En soumettant le milieu à des impulsions ultra courtes, il est possible d'avoir accès, par une étude fréquentielle de la propagation de ces impulsions
20 dans le conducteur, à des régimes transitoires ultra brefs et à des informations sur la résistance ohmiques du conducteur (voir figure 5d).

Selon encore une application du procédé selon l'invention, on étudie des phénomènes de report de champ, de
25 recouvrement spatial, etc. Dans les composants opto-électroniques, le champ appliqué entre des électrodes n'a pas toujours une forme simple (voir figure 5e). Il peut en particulier se poser des problèmes de report de champ et de recouvrement spatial, à la fois statique ("poling" de la
30 couche active du composant) et dynamique (champ de modulation). Grâce à la cartographie des champs électriques, obtenue avec le procédé selon l'invention, il est possible d'optimiser la forme et la structure de ces composants, pour

aboutir, par exemple, à la réduction de la tension de commande.

Selon encore une autre application du procédé selon l'invention, on étudie des agrégats fractals et en particulier la percolation dans ces agrégats. Dans la zone à sonder 34 se trouve au moins une partie d'un agrégat fractal (voir figure 5f).

On trouve également des applications particulièrement intéressantes du dispositif et du procédé selon l'invention dans le domaine de la biologie. Dans ce cas, la zone à sonder 34 comporte au moins une partie d'un milieu biologique naturel ou artificiel. En effet, par exemple, la zone à sonder 34 comporte au moins une partie d'une membrane biologique naturelle ou artificielle.

Ainsi, selon une application du procédé selon l'invention, on étudie des systèmes biomimétiques et par exemple la diffusion d'espèces moléculaires à travers des membranes artificielles. Des modifications de ces membranes dues à divers type de phénomènes (chimiques, biochimiques, électriques, rayonnement électromagnétique, etc.) peuvent être détectées grâce au dispositif selon l'invention. Ce type d'application peut s'étendre à l'étude de systèmes microfluidiques, de capsules, de vésicules, etc.

Aussi, selon une application du procédé selon l'invention, on étudie des systèmes biologiques tels que les neurones, les cellules zoologiques ou végétales, etc.

Dans le cadre de l'étude de neurones sains, la zone à sonder 34 comporte au moins une partie d'un neurone ou d'un réseau de neurones et le dispositif selon l'invention donne accès à la propagation des signaux électriques neuronaux et/ou interneuronaux, l'origine de ces signaux, etc. Le dispositif selon l'invention dans ce cas remplace avantageusement les techniques dites de "patch-clamp" pour

lesquelles, par exemple pour un champ d'observation de $10 \times 10 \mu\text{m}^2$, il aurait fallu plusieurs dizaines de milliers d'électrodes, ou plus, pour obtenir une cartographie équivalente. Grâce au dispositif selon l'invention, on
5 s'affranchit en outre des problèmes de contact, d'encombrement stérique, etc..

Le dispositif selon l'invention, permet aussi l'étude de neurones perturbés ou pathologiques, sclérosés, dégénérés, etc.

10 Grâce au dispositif selon l'invention, on peut aussi observer des phénomènes électriques à petites échelles, tels que les phénomènes de surtension ou ceux se produisant dans les réactions chimiques d'oxydo-réduction, dans les réacteurs chimiques à des échelles nanométriques ou non, au
15 niveau de micelles, de complexes argilo-humique, etc. La zone à sonder 34 constitue alors au moins une partie d'un milieu chimique.

Dans certains cas, que ce soit en électronique ou en biologie, le milieu doit être dopé avec des molécules ou des
20 ions électro-optiques, afin d'exacerber les propriétés électro-optiques du milieu et/ou permettre d'observer des champs électriques dans des milieux dépourvus de telles propriétés.

A titre d'exemple de molécules électro-optiques, on
25 cite les molécules suivantes :

- La molécule "DR1" (Dispersed Red One) est bien connue de l'Homme du Métier. Elle est plutôt utilisée pour l'étude de composants opto-électroniques et les systèmes biomimétiques.

30 - La molécule "Cristal Violet" est aussi bien connue de l'Homme du Métier. Elle constitue un exemple d'octupôle. Elle est sensible aux gradients successifs du champ électrique et non au champ électrique lui-même. On

n'est en effet pas limité dans la détection des champs électriques selon le procédé conforme à la présente invention, à des non-linéarités d'ordre 2, on peut utiliser des non linéarités d'ordre supérieur.

5 - Des molécules dérivées de la phtalocyanine par substitution périphérique avec des groupements donneurs et accepteurs d'électrons en géométrie non-centrosymétrique, sont également connues de l'Homme du Métier. Elles peuvent être utilisées pour l'étude de systèmes biologiques.

10 De nombreuses autres molécules peuvent être utilisées. Il peut s'agir en particulier de différentes formes des molécules indiquées ci-dessus ou dérivées de ces dernières.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de détection non invasive des propriétés d'un milieu par interférométrie, ce dispositif
5 comprenant :

- une source optique (3) pour éclairer au moins une zone à sonder (34) du milieu avec un faisceau lumineux (19) dont le parcours définit un axe optique,

- des moyens de mesure des variations de la phase
10 du faisceau lumineux (7) au cours de son passage dans la zone à sonder (34), ces moyens de mesure

. comprenant un interféromètre (5) pour diviser le faisceau lumineux (19) en un faisceau de référence (21) et un faisceau sonde (23), dans cet interféromètre (5).
15 l'asservissement des longueurs respectives du faisceau de référence (21) et du faisceau sonde (23) étant actif jusqu'à une fréquence de coupure f_c , et

. ayant une fréquence d'échantillonnage de signal f_a ,

20 caractérisé par le fait qu'il comporte des moyens de balayage (33) adaptés pour balayer, avec le faisceau sonde (23), la zone à sonder (34) et une zone de référence (36), avec une fréquence f d'acquisition d'images enregistrées par les moyens de mesure des variations de la phase du faisceau
25 lumineux (7), supérieure à la fréquence de coupure f_c .

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les moyens de balayage (33) balayent la zone à sonder (34) et la zone de référence (36), selon une première direction de l'espace à une fréquence f_x et selon une deuxième
30 direction de l'espace avec une fréquence f_y , pour former une image de n pixels selon la première direction et m pixels selon la deuxième direction, les fréquences f_x et f_y étant choisies telles que $f_x = f_y/n$ et $f_y = f_a/m$, f_x et f_y étant

supérieures à f_c .

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel les moyens de mesure des variations de la phase du faisceau lumineux (7) comprennent un microscope confocal (15), dans lequel est placée la zone à sonder (34) de manière adaptée pour former une image d'un plan de la zone à sonder (34).

4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, comportant des moyens de déplacement du milieu, selon les trois dimensions de l'espace, sous le faisceau sonde (23).

5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel, les moyens de balayage (33) comprennent quatre déflecteurs acousto-optiques (35), deux pour défléchir le faisceau lumineux, en amont du microscope confocal (15), chacun respectivement dans l'une des première et deuxième directions de l'espace et deux pour redresser le faisceau lumineux chacun respectivement dans l'une des première et deuxième directions de l'espace, en aval du microscope confocal (15).

6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel au moins un déflecteur acousto-optique (35), en aval du microscope confocal (15), est réglé pour incliner l'ordre 0 du faisceau lumineux par rapport à l'axe optique, et conserver l'ordre 1 paraxial.

7. Dispositif selon la revendication 6, comprenant, une lunette de Galilée pour augmenter l'angle α entre l'ordre 1 et l'axe optique.

8. Dispositif selon l'une des revendications précédentes comportant en outre, en amont du microscope confocal (15), des moyens de contrôle de la polarisation (37) du faisceau sonde (23) en incidence sur la zone à sonder (34).

9. Procédé de détection non invasive des propriétés d'un milieu par interférométrie, dans lequel :

- on éclaire au moins une zone à sonder (34) du milieu avec une source optique (3) générant un faisceau lumineux (19) dont le parcours définit un axe optique,
 - on utilise un interféromètre (5) pour diviser le faisceau lumineux (19) en un faisceau de référence (21) et un faisceau sonde (23) et mesurer le déphasage entre le faisceau de référence (21) et le faisceau sonde (23) après traversée de la zone à sonder (34),
 - on asservit des longueurs respectives du faisceau de référence (21) et du faisceau sonde (23) à des moyens de photo-détection (29) et
 - on acquiert, avec les moyens de photo-détection (29), des images correspondant à la mesure du déphasage en différents points de la zone à sonder (34), à une fréquence d'échantillonnage de signal f_a supérieure à la fréquence de coupure f_c de l'asservissement des longueurs respectives du faisceau de référence (21) et du faisceau sonde (23),
 - caractérisé par le fait qu'on balaye avec le faisceau sonde (23), la zone à sonder (34) et une zone de référence (36), avec une fréquence f d'acquisition d'images enregistrées par les moyens de mesure des variations de la phase du faisceau lumineux (7), supérieure à la fréquence de coupure f_c .
10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel on procède à un balayage de la zone à sonder (34) et la zone de référence (36), selon une première direction de l'espace à une fréquence f_x et selon une deuxième direction de l'espace avec une fréquence f_y , pour former une image de n pixels selon la première direction et m pixels selon la deuxième direction, les fréquences f_x et f_y étant choisies telles que $f_x = f_y / n$ et $f_y = f_a / m$, f_x et f_y étant supérieures à f_c .

11. Procédé selon l'une des revendications 9 et 10,

dans lequel on place la zone à sonder (34) dans un microscope confocal (15), de manière adaptée pour former une image d'un plan de la zone à sonder (34).

12. Procédé selon l'une des revendications 9 à 11, dans lequel on déplace le milieu, selon les trois dimensions de l'espace, sous le faisceau sonde (23).

13. Procédé l'une des revendications 9 à 12, dans lequel on excite le milieu à une fréquence f_e et on mesure la variation de la phase du faisceau sonde (23) par rapport à celle du faisceau de référence (21), à cette même fréquence f_e .

14. Procédé selon l'une des revendications 9 à 13, dans lequel on dévie, grâce à au moins un défecteur acousto-optique (35) en aval du microscope confocal, l'ordre 0 du faisceau lumineux par rapport à l'axe optique, et conserver l'ordre 1 paraxial.

15. Procédé selon la revendication 14, dans lequel on augmente l'angle α entre l'ordre 1 et l'axe optique, grâce à une lunette de Galilée.

16. Procédé selon l'une des revendications 9 à 15 dans lequel la zone à sonder (34) comporte au moins une partie d'un composant opto-électronique auquel on applique un potentiel.

17. Procédé selon la revendication 16, dans lequel on applique le potentiel par l'intermédiaire d'au moins une électrode dont la forme est adaptée pour créer un gradient de champ électrique.

18. Procédé selon l'une des revendications 16 et 17, dans lequel on applique le potentiel par l'intermédiaire d'au moins une électrode multipolaire.

19. Procédé selon l'une des revendications 16 à 18, dans lequel on place le composant opto-électronique dans un milieu optiquement actif.

20. Procédé selon l'une des revendications 16 à 19, dans lequel on étudie la propagation d'une impulsion électrique dans le composant opto-électronique.

5 21. Procédé selon l'une des revendications 9 à 15, dans lequel la zone à sonder (34) comporte au moins une partie d'un agrégat fractal.

22. Procédé selon l'une des revendications 9 à 15, dans lequel la zone à sonder (34) comporte au moins une partie d'un milieu biologique.

10 23. Procédé selon la revendication 22, dans lequel la zone à sonder (34) comporte au moins une partie d'une membrane biologique.

24. Procédé selon l'une des revendications 22 et 23, dans lequel la zone à sonder (34) comporte au moins une
15 partie d'un neurone ou d'un réseau de neurones.

25. Procédé selon l'une des revendications 9 à 15, dans lequel la zone à sonder (34) comporte au moins une partie d'une membrane artificielle.

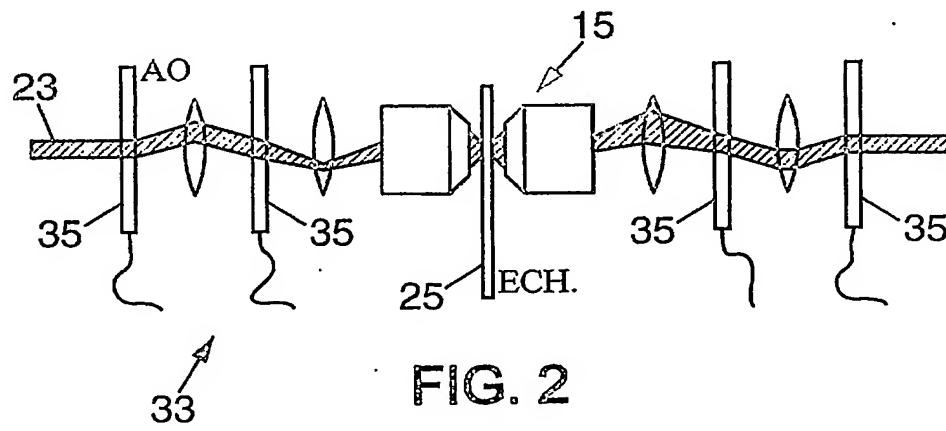
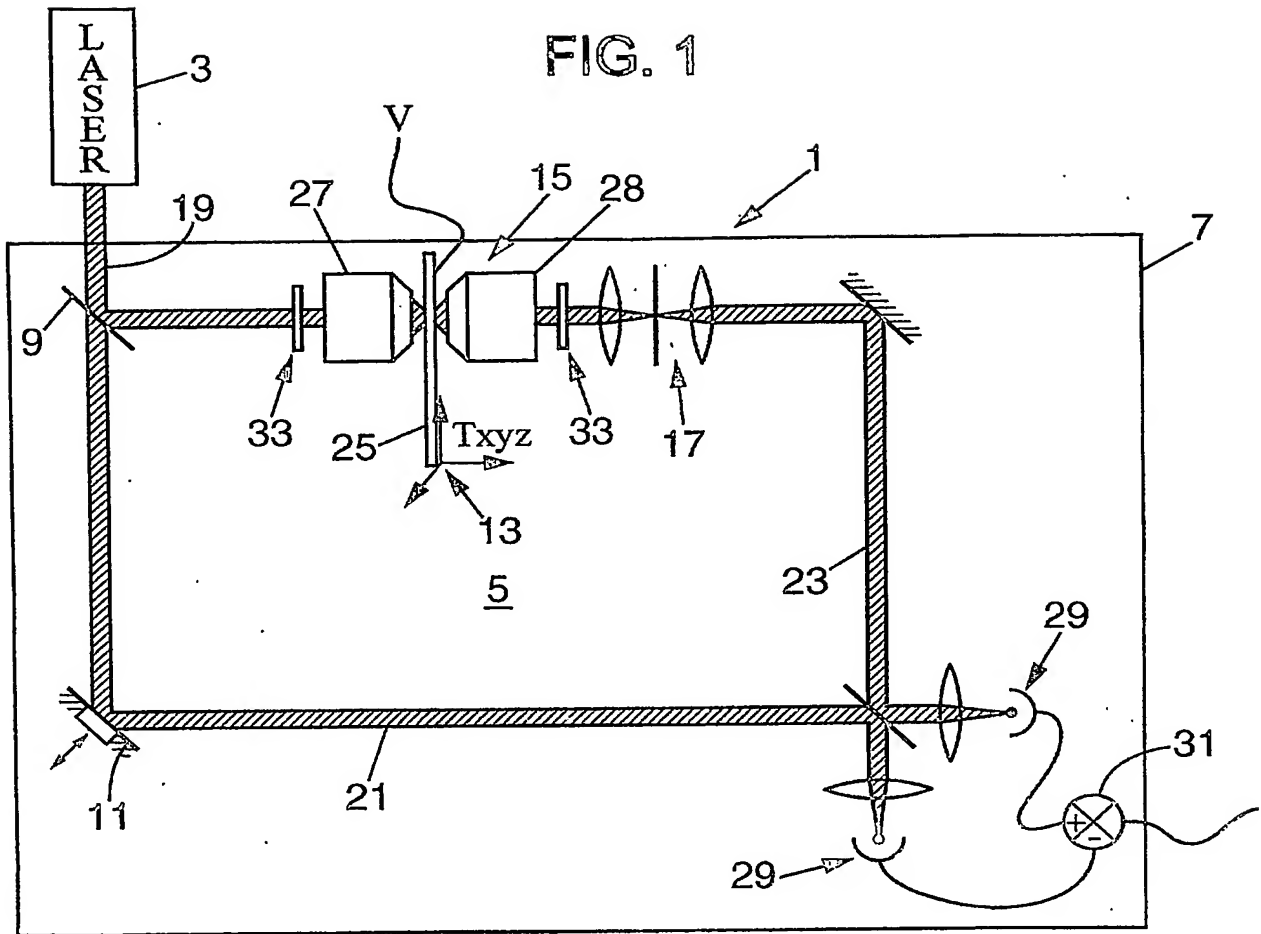
26. Procédé selon l'une des revendications 9 à 15,
20 dans lequel la zone à sonder (34) constitue au moins une partie d'un milieu chimique.

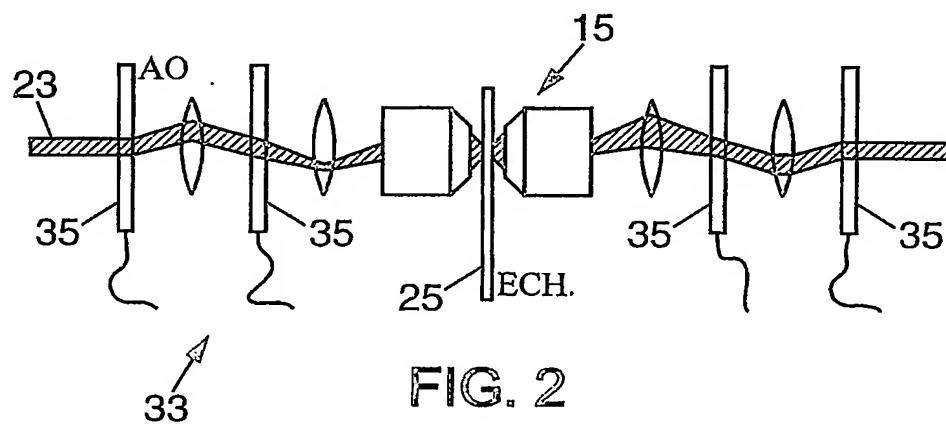
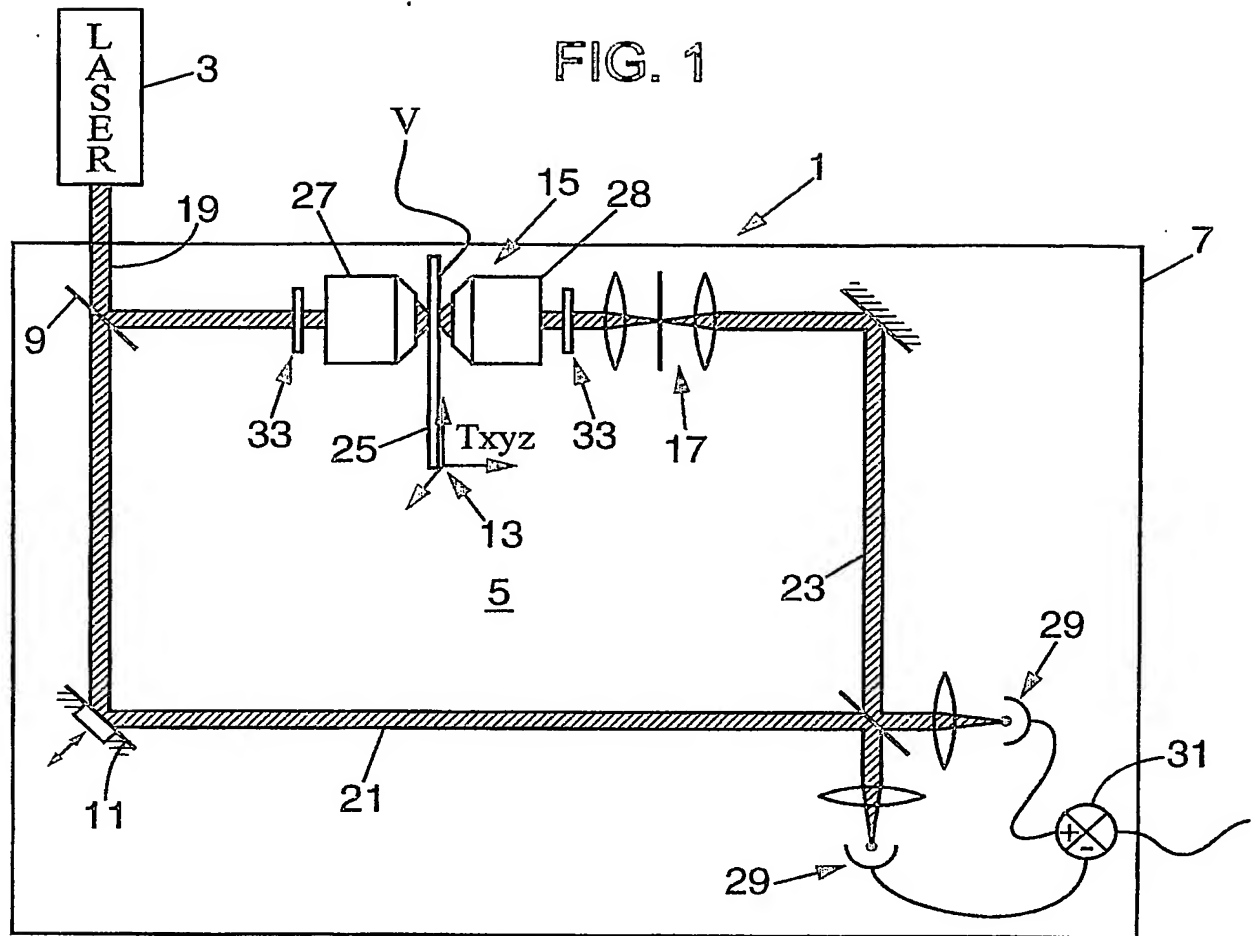
27. Procédé selon l'une des revendications 9 à 26, dans lequel on dope le milieu avec des molécules ou des ions ayant des propriétés électro-optiques, ou conférant au
25 milieu des propriétés électro-optiques, afin d'exacerber les propriétés électro-optiques du milieu, si celui-ci en est déjà doté, ou pour révéler la présence de champs électriques dans un milieu qui ne possède pas intrinsèquement de telles propriétés.

30 28. Procédé selon l'une des revendications 9 à 27, dans lequel, connaissant la distribution des propriétés électro-optiques du milieu, on réalise une cartographie du champ électrique dans le milieu.

29. Procédé selon l'une des revendications 9 à 27, dans lequel on génère un champ électrique de configuration connue dans le milieu, de manière à révéler des propriétés électro-optiques du milieu.

FIG. 1





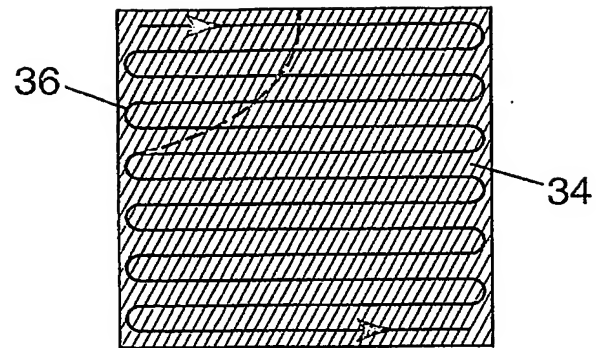


FIG. 3

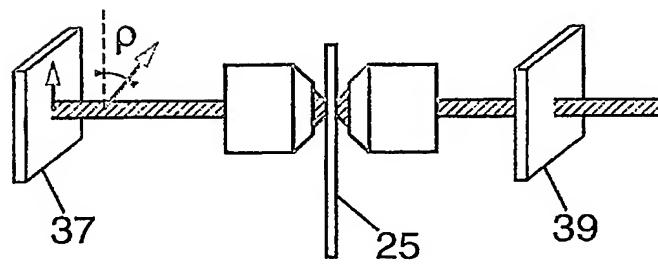


FIG. 5/4

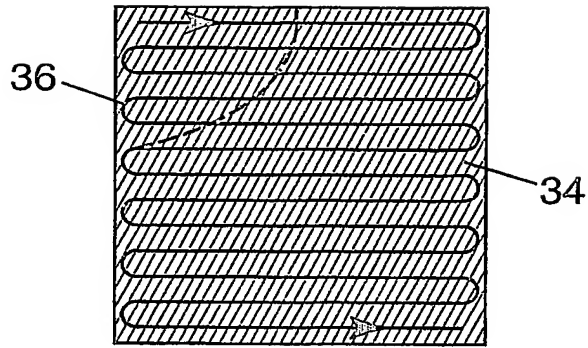


FIG. 3

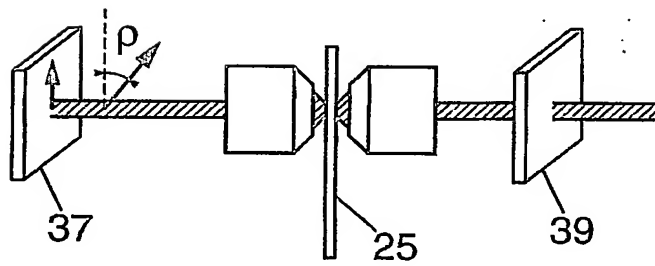


FIG. 4

10 μm (échelle indicative)

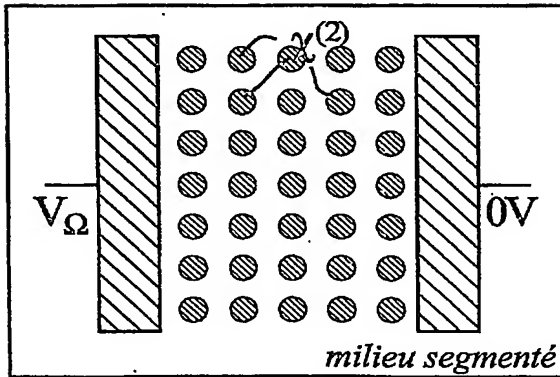


FIG. 5a

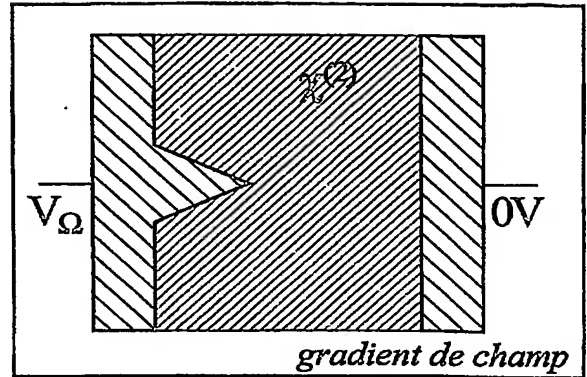


FIG. 5b

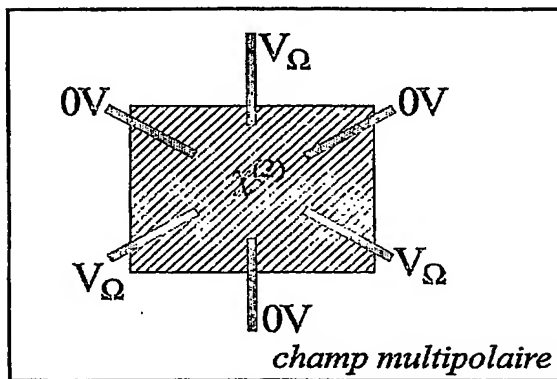


FIG. 5c

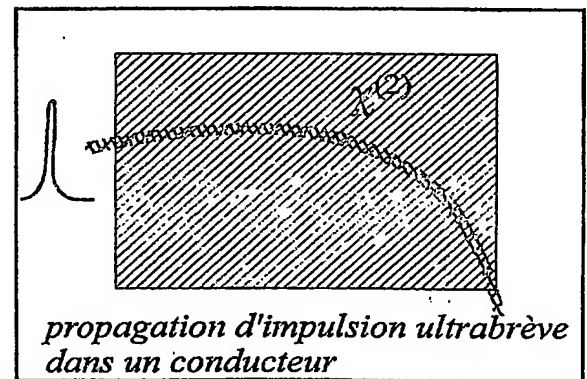


FIG. 5d

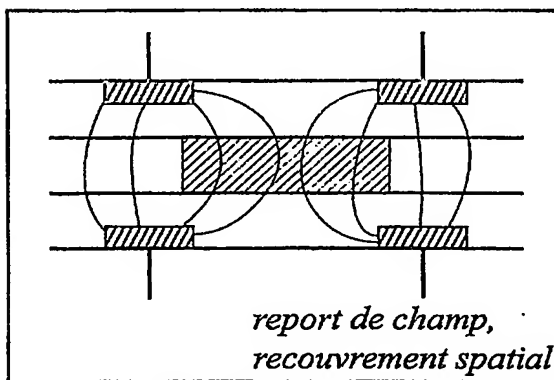


FIG. 5e

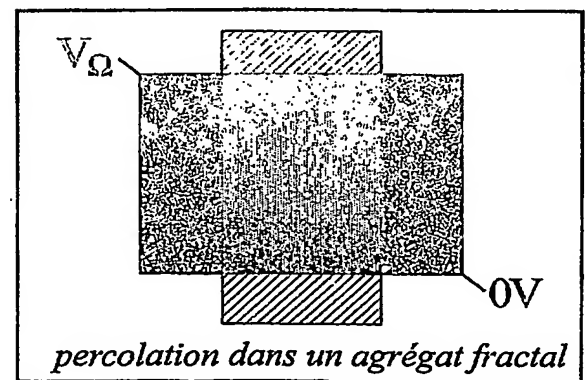


FIG. 5f

10 μm (échelle indicative)

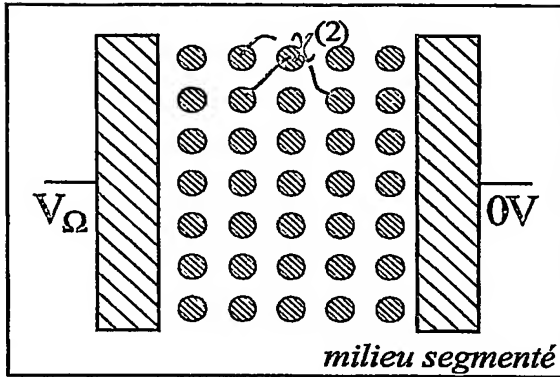


FIG. 5a

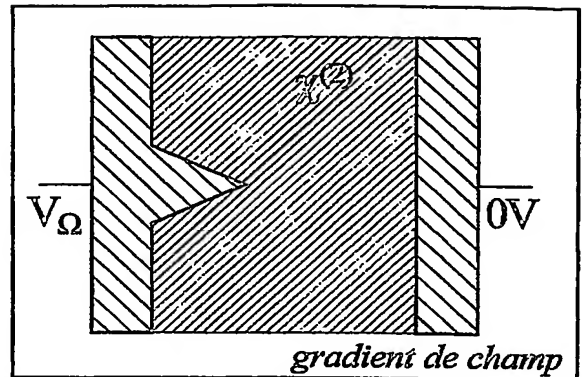


FIG. 5b

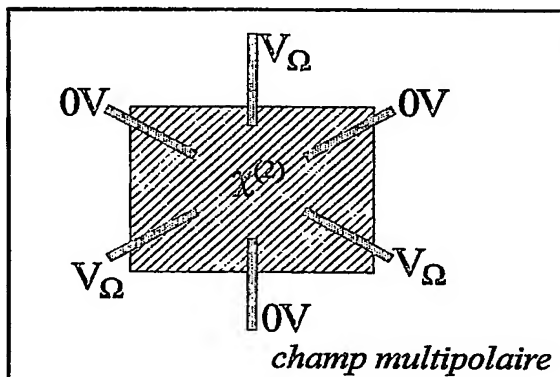


FIG. 5c

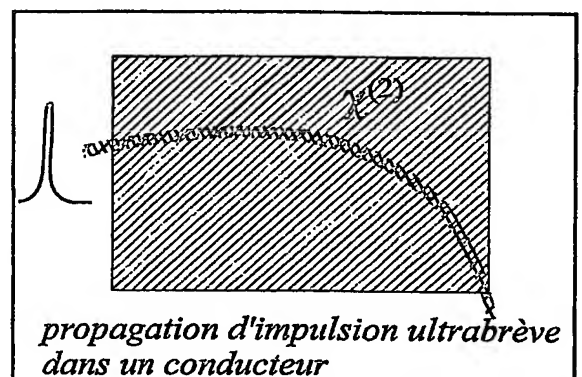


FIG. 5d

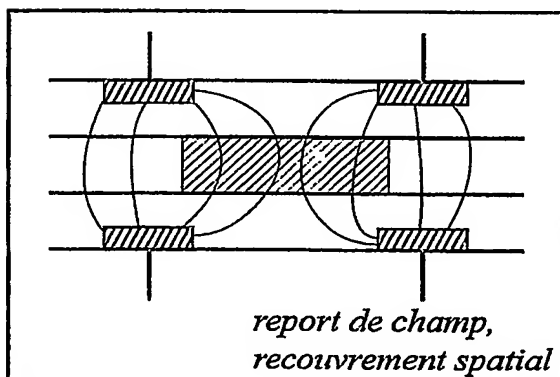


FIG. 5e

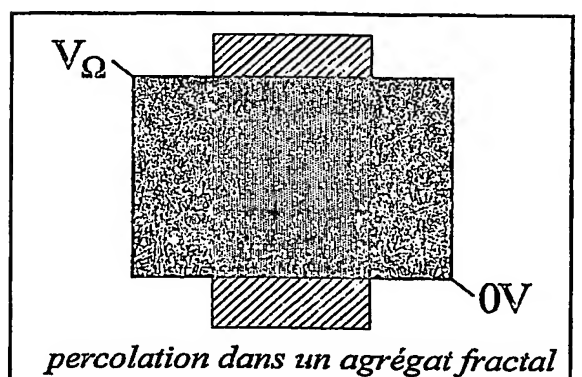


FIG. 5f

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.../1.

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DS 113 W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)			
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		BFF030311	03101116
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
DISPOSITIF ET PROCEDE DE DETECTION ET DE MESURE NON INVASIVES DES PROPRIETES D'UN MILIEU			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :			
1	Nom		
	Prénoms		
Adresse	Rue	TOURY Timothée, Pol, Jean	
	Code postal et ville	45, rue de la Gare	08090 TOURNES FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
2	Nom		
	Prénoms	ZYSS Joseph	
Adresse	Rue		
	Code postal et ville	56, avenue Lenôtre	92330 SCEAUX FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
3	Nom		
	Prénoms		
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		Le 22 août 2003 CABINET PLASSERAUD Eric BURBAUD 94-0304	

Cadre n° VIII.iv) DÉCLARATION : QUALITÉ D'INVENTEUR
(seulement aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique)

La déclaration doit être conforme au libellé standard suivant prévu à l'instruction 214: voir les notes relatives aux cadres n° VIII, VIII.i) à v) (généralités) et les notes spécifiques au cadre n° VIII.iv). Si ce cadre n'est pas utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.

Déclaration relative à la qualité d'inventeur (règles 4.17.iv) et 51bis.1.a)iv))
aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique :

Par la présente, je déclare que je crois être le premier inventeur original et unique (si un seul inventeur est mentionné ci-dessous) ou l'un des premiers co-inventeurs (si plusieurs inventeurs sont mentionnés ci-dessous) de l'objet revendiqué pour lequel un brevet est demandé.

La présente déclaration a trait à la demande internationale dont elle fait partie (si la déclaration est déposée avec la demande).

La présente déclaration a trait à la demande internationale n° PCT/..... (si la déclaration est remise en vertu de la règle 26ter).

Par la présente, je déclare que mon domicile, mon adresse postale et ma nationalité sont tels qu'indiqués près de mon nom.

Par la présente, je déclare avoir passé en revue et compris le contenu de la demande internationale à laquelle il est fait référence ci-dessus, y compris les revendications de ladite demande. J'ai indiqué dans la requête de ladite demande, conformément à la règle 4.10 du PCT, toute revendication de priorité d'une demande étrangère et j'ai identifié ci-dessous, sous l'intitulé "Demandes antérieures", au moyen du numéro de demande, du pays ou du membre de l'Organisation mondiale du commerce, du jour, du mois et de l'année du dépôt, toute demande de brevet ou de certificat d'auteur d'invention déposée dans un pays autre que les États-Unis d'Amérique, y compris toute demande internationale selon le PCT désignant au moins un pays autre que les États-Unis d'Amérique, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande étrangère dont la priorité est revendiquée.

Demandes antérieures :

Par la présente, je reconnais l'obligation qui m'est faite de divulguer les renseignements dont j'ai connaissance et qui sont pertinents quant à la brevetabilité de l'invention, tels qu'ils sont définis dans le Titre 37, § 1.56, du Code fédéral des réglementations, y compris, en ce qui concerne les demandes de continuation-in-part les renseignements pertinents qui sont devenus accessibles entre la date de dépôt de la demande antérieure et la date du dépôt international de la demande de continuation-in-part.

Je déclare par la présente que toute déclaration ci-incluse est, à ma connaissance, véridique et que toute déclaration formulée à partir de renseignements ou de suppositions est tenue pour véridique; et de plus, que toutes ces déclarations ont été formulées en sachant que toute fausse déclaration volontaire ou son équivalent est passible d'une amende ou d'une incarcération, ou des deux, en vertu de la Section 1001 du Titre 18 du Code des États-Unis, et que de telles déclarations volontairement fausses risquent de compromettre la validité de la demande de brevet ou du brevet délivré à partir de celle-ci.

Nom : **TOURY Timothée, Pol, Jean**

Domicile : **08090 TOURNES (FRANCE)**

(ville et État (des États-Unis d'Amérique), le cas échéant, ou pays)

Adresse postale : **45, rue de la Gare - 08090 TOURNES (FRANCE)**

Nationalité : **Française**

Signature de l'inventeur :
(si elle ne figure pas dans la requête, ou si la déclaration a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale. La signature doit être celle de l'inventeur, il ne peut s'agir de celle du mandataire)

Date :
(de la signature qui ne figure pas dans la requête, ou de la déclaration qui a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale)

Nom : **ZYSS Joseph**

Domicile : **92330 SCEAUX (FRANCE)**

(ville et État (des États-Unis d'Amérique), le cas échéant, ou pays)

Adresse postale : **56, avenue Lenôtre - 92330 SCEAUX (FRANCE)**

Nationalité : **Française**

Signature de l'inventeur :
(si elle ne figure pas dans la requête, ou si la déclaration a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale. La signature doit être celle de l'inventeur, il ne peut s'agir de celle du mandataire)

Date :
(de la signature qui ne figure pas dans la requête, ou de la déclaration qui a fait l'objet de corrections ou d'adjonctions en vertu de la règle 26ter après le dépôt de la demande internationale)

☐ Cette déclaration continue sur la feuille suivante, "Suite du cadre n° VIII.iv)".

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.